DELPHION

035576/275

(හික්ක්ෂයි (

RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION



Search: Quick/Number Boolean Advanced Der

The Delphion Integrated View

Tools: Add to Work File: Create new Work Buy Now: PDF | File History | Other choices View: INPADOC | Jump to: Top ∇ Go to: Derwent

> JP2001354904A2: COMPOSITION FOR FILM FORMATION, METHOD

> > FORMING FILM AND SILICA-BASED FILM

Propert Title: Composition for film formation, comprises product obtained by hydrolyzing

and condensing at least one silane compound and an organic solvent

[Derwent Record]

JP Japan 윟Country:

> A2 Document Laid open to Public inspection !

§Inventor: **HAYASHI EIJI:**

HASEGAWA KOICHI: JO YOSHIHIDE;

JSR CORP ♥Assignee:

News, Profiles, Stocks and More about this company

C09D 183/04; C09D 183/02; C09D 183/14; H01L 21/312;

2001-12-25 / 2000-11-29 Published / Filed:

> JP2000000363513

Number: §IPC Code:

Priority Number: 2000-04-10 JP2000000108311

> PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a composition for forming

> > a film as an interlayer insulating film material for a semiconductor element, or the like, capable of giving a silica-based film excellent in relative dielectric constant characteristics after PCT(pressure Cooker Test), CMP(Chemical Mechanical Polishing) resistance

after PCT and adhesion to a substrate after PCT.

SOLUTION: The composition for forming a film comprises (A) a hydrolyzate condensate of at least one compound selected from the group consisting of compounds represented by general formula 1, 2 or 3 in the presence of at least one compound selected from a tetraalkyl ammonium hydroxide, an alicyclic amine and a metal hydroxide and water and (B) an organic solvent: the general formulae RaSi(OR1)4-a... (1), Si(OR2)4... (2), R3b(R4O)3-bSi-(R7) d-Si(OR5)3-cR6c... (3), wherein R is hydrogen or fluorine atom or a monovalent organic group; R1-R6 are each a monovalent organic group; R7 is oxygen atom, a phenylene group or (CH2)n; (a) is 1-2;

(b) and (c) are each 0-2; (d) is 0 or 1; and (n) is 1-6.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

PINPADOC

None **Buy Now:** Family Legal Status Report

Legal Status:

♀ Designated

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

Country:

Show 13 known family members ਊ Family:



(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-354904

(P2001-354904A)

(43)公開日 平成13年12月25日(2001.12.25)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード (参考)
C09D183/04		C09D183/04	4J038
183/02		183/02	5F058
183/14		183/14	
H01L 21/312		H01L 21/312	С

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全15頁)

	·	伊耳明不	、不謂不 謂不侵の數 / 〇 (至10頁)		
(21)出願番号	特願2000-363513(P2000-363513)	(71)出願人			
		•	ジェイエスアール株式会社		
(22)出願日	平成12年11月29日(2000.11.29)		東京都中央区築地2丁目11番24号		
		(72)発明者	林 英治		
(31)優先権主張番号	特願2000-108311(P2000-108311)	1	東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ		
(32)優先日	平成12年4月10日(2000.4.10)		スアール株式会社内		
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	長谷川 公一		
			東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ		
			スアール株式会社内		
		(72)発明者	徐 榮秀		
			大韓民国 忠清南道 天安市 雙龍洞 12		
	•		73番地 現代アパートメント401-702		
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】膜形成用組成物、膜の形成方法およびシリカ系膜

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、PCT (Presure Cooker Test) 後の比誘電率特性、PCT後のCMP (Chemical Mechanical Polishing) 耐性、PCT後の基板との密着性に優れたシリカ系膜が形成可能な膜形成用組成物を得る。

【解決手段】 (A) 一般式1、2、3で表される化合物の群から選ばれた1以上の化合物を水酸化テトラアルキルアンモニウム、脂肪族環状アミン、金属水酸化物から選ばれた一種の化合物と水の存在下で加水分解縮した化合物ならびに(B) 有機溶媒を含有する膜形成用組成物。

R. Si (OR') \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots

 $Si(OR^2)$, (2) R^3 , (R^4O) 3, $Si-(R^7)$, -Si(OR)

 $(R_{+}, (R_{-}))_{3}, (R_{-}, (R_{-}))_{3}$

または1、nは1~6を示す。)

【特許請求の範囲】

(A) 下記一般式(1) で表される化 【請求項1】 合物、下記一般式(2)で表される化合物および下記一 般式(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくと も1種のシラン化合物を水酸化テトラアルキルアンモニ ウム、脂肪族環状有機アミン、金属水酸化物の群から選 ばれる少なくとも1種の化合物と水の存在下で加水分解

$$R^{3}$$
 b $(R^{4} O)^{2}$ 3 b $Si - (R^{7})_{4} - Si (OR^{6})_{3}$ c R^{6} . · · (3)

[式中、 R^3 $\sim R^6$ は同一または異なり、それぞれ1価 の有機基、bおよびcは同一または異なり、0~2の数 10 を示し、R'は酸素原子、フェニレン基または-(CH ,)。-で表される基(ここで、nは1~6の整数であ る)、dは0または1を示す。〕ならびに(B)有機溶 媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 水酸化テトラアルキルアンモニウムが水 酸化テトラメチルアンモニウム、脂肪族環状有機アミン がピペリジン誘導体、ピペラジン誘導体、ピロリジン誘 導体、ジアザビシクロオクタン、ジアザビシクロノナ ン、ジアザビシクロウンデセン、金属水酸化物が水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウムであるこ

(R°およびR°は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 1~4のアルキル基またはCH,CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。)

RO (CHCH, CH, O), R'

【請求項6】 請求項1~5項いずれかに記載の膜形 成用組成物を基板に塗布し、加熱することを特徴とする 膜の形成方法。

請求項6記載の膜の形成方法によって 【請求項7】 得られるシリカ系膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 縁膜材料として、PCT (Presure Cooke r Test)後の比誘電率特性、PCT後のCMP (Chemical Mechanical Polis hing) 耐性、PCT後の基板との密着性に優れたシ リカ系膜が形成可能な膜形成用組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 40 膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシ リカ(SiO,)膜が多用されている。そして、近年、 より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、S OG (Spin on Glass) 膜と呼ばれるテト ラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布 型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導 体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるポ リオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電率の層間 絶縁膜が開発されている。特に半導体素子などのさらな

し、縮合した加水分解縮合物

R. Si (OR') $\cdots \cdots (1)$

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R'は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) ·Si (OR²), $\cdots (2)$

(式中、R² は1価の有機基を示す。)

とを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項3】 水酸化テトラアルキルアンモニウム、脂 肪族環状有機アミン、金属水酸化物の群から選ばれる少 なくとも1種の化合物の使用量が、シラン化合物のアル コキシル基の総量1モルに対して0.0001~10 モルであることを特徴とする請求項1記載の膜形成用組 成物。

【請求項4】 pHが7以下であることを特徴とする請 求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項5】 (B) 有機溶剤が、下記一般式(4)で 表される溶剤であることを特徴とする請求項1記載の膜 形成用組成物。

$\cdots (4)$

縁性が要求されており、したがって、より低比誘電率で かつクラック耐性に優れる層間絶縁膜材料が求められる ようになっている。

【0003】低比誘電率の材料としては、アンモニアの 存在下にアルコキシシランを縮合して得られる微粒子と アルコキシシランの塩基性部分加水分解物との混合物が らなる組成物(特開平5-263045、同5-315 319) や、ポリアルコキシシランの塩基性加水分解物 30 をアンモニアの存在下縮合することにより得られた塗布 液(特開平11-340219、同11-34022 0)が提案されているが、これらの方法で得られる材料 は、反応の生成物の性質が安定せず、PCT後の比誘電 率特性、PCT後のCMP耐性、PCT後の基板との密 着性などの膜特性のバラツキも大きいため、工業的生産 には不向きであった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しく は、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、PCT 後の比誘電率特性、PCT後のCMP耐性、PCT後の 基板との密着性に優れた膜形成用組成物および該組成物 から得られるシリカ系膜を提供することを目的とする。 [0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)下記一 般式(1)で表される化合物(以下、「化合物1」とい う)、下記一般式(2)で表される化合物(以下、「化 合物2」という)および下記一般式(3)で表される化 合物(以下、「化合物3」という)の群から選ばれた少 る髙集積化や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶 50 なくとも1種のシラン化合物を水酸化テトラアルキルア

ンモニウム、脂肪族環状有機アミン、金属水酸化物の群 から選ばれる少なくとも1種の化合物(以下、「特定塩 基性化合物」という)と水の存在下で加水分解し、縮合 した加水分解縮合物

R. Si (OR') +- $\cdots \cdots (1^{\cdot})$

[式中、 $R^3 \sim R^6$ は同一または異なり、それぞれ1価 の有機基、bおよびcは同一または異なり、0~2の数 を示し、R'は酸素原子、フェニレン基または-(CH 2)。一で表される基(ここで、nは1~6の整数であ る)、dは0または1を示す。] ならびに(B) 有機溶 媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物に関す る。次に、本発明は、上記膜形成用組成物を基板に塗布 し、加熱することを特徴とする膜の形成方法に関する。 次に、本発明は、上記膜の形成方法によって得られるシ リカ系膜に関する。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明において、(A)加水分解 縮合物とは、上記化合物(1)~(3)の群から選ばれ た少なくとも1種の加水分解物およびその縮合物もしく はいずれか一方である。ここで、(A)成分における加 水分解物とは、上記(A)成分を構成する化合物(1) ~ (3) に含まれるR' O-基, R' O-基およびR⁵ O-基のすべてが加水分解されている必要 はなく、例えば、1個だけが加水分解されているもの、 2個以上が加水分解されているもの、あるいは、これら の混合物であってもよい。また、(A)成分における縮 合物は、(A)成分を構成する化合物(1)~(3)の 加水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結 合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基 がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノ ール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているもの の混合物などをも包含した概念である。

【0007】(A)加水分解縮合物

(A) 加水分解縮合物は、上記化合物(1)~(3)の 群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を特定塩 基性化合物の存在下に、加水分解、縮合して得られる。 化合物(1);上記一般式(1)において、RおよびR ' の1価の有機基としては、アルキル基、アリール基、 アリル基、グリシジル基などを挙げることができる。ま 40 た、一般式(1)において、Rは1価の有機基、特にア ルキル基またはフェニル基であることが好ましい。ここ で、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピ ル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~ 5であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐してい てもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換され ていてもよい。一般式(1)において、アリール基とし ては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エ チルフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル 基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R'は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) • • • • • (2) Si(OR'),

(式中、R² は1価の有機基を示す。)

 R^{3} b $(R^{4} O)_{3-6}$ $Si - (R^{7})_{4} - Si (OR^{6})_{3-6}$ R^{6} . • (3)

【0008】一般式(1)で表される化合物の具体例と しては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、ト リーn-プロポキシシラン、トリーiso-プロポキシ 10 シラン、トリーn-ブトキシシラン、トリーsec-ブ トキシシラン、トリーtert-ブトキシシラン、トリ フェノキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フル オロトリエトキシシラン、フルオロトリーnープロポキ シシラン、フルオロトリーiso-プロポキシシラン、 フルオロトリーn-プトキシシラン、フルオロトリーs ecーブトキシシラン、フルオロトリーtertーブト キシシラン、フルオロトリフェノキシシランなど; 【0009】メチルトリメトキシシラン、メチルトリエ トキシシラン、メチルトリーnープロポキシシラン、メ チルトリーiso-プロポキシシラン、メチルトリーn ープトキシシラン、メチルトリーsecープトキシシラ ン、メチルトリーtert-ブトキシシラン、メチルト リフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチ ルトリエトキシシラン、エチルトリーnープロポキシシ ラン、エチルトリーiso-プロポキシシラン、エチル トリーnーブトキシシラン、エチルトリーsecーブト キシシラン、エチルトリーtertーブトキシシラン、 エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリーnープロ ポキシシラン、ビニルトリーiso-プロポキシシラ ン、ビニルトリーnーブトキシシラン、ビニルトリーs ecーブトキシシラン、ビニルトリーtertープトキ シシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n-プロピル トリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラ ン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、nープ ロピルトリーiso-プロポキシシラン、n-プロピル トリーnーブトキシシラン、nープロピルトリーsec ーブトキシシラン、nープロピルトリーtertーブト キシシラン、nープロピルトリフェノキシシラン、i-プロピルトリメトキシシラン、i-プロピルトリエトキ シシラン、iープロピルトリーnープロポキシシラン、 iープロピルトリーisoープロポキシシラン、iープ ロピルトリーnープトキシシラン、iープロピルトリー secーブトキシシラン、iープロピルトリーtert ープトキシシラン、iープロピルトリフェノキシシラ ン、nーブチルトリメトキシシラン、nーブチルトリエ トキシシラン、nープチルトリーnープロポキシシラ ン、n-ブチルトリーiso-プロポキシシラン、n-ブチルトリーnーブトキシシラン、nープチルトリーs 50 ec-ブトキシシラン、n-ブチルトリーtert-ブ

トキシシラン、nーブチルトリフェノキシシラン、se cーブチルトリメトキシシラン、secーブチルトリエ トキシシラン、secーブチルートリーnープロポキシ シラン、secーブチルートリーisoープロポキシシ ラン、sec-ブチルートリーn-ブトキシシラン、s ecーブチルートリーsecーブトキシシラン、sec ープチルートリーtertーブトキシシラン、sec-プチルートリフェノキシシラン、 t ープチルトリメトキュ シシラン、tープチルトリエトキシシラン、tープチル トリーnープロポキシシラン、tーブチルトリーiso ープロポキシシラン、tーブチルトリーn-ブトキシシ ラン、tープチルトリーsecーブトキシシラン、tー プチルトリーtertーブトキシシラン、tーブチルト リフェノキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ エニルトリエトキシシラン、フェニルトリーnープロポ キシシラン、フェニルトリーisoープロポキシシラ ン、フェニルトリーnーブトキシシラン、フェニルトリ -sec-ブトキシシラン、フェニルトリーtert-ブトキシシラン、フェニルトリフェノキシシラン、ビニ ルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-アミノプロ ピルトリエトキシシラン、ソーグリシドキシプロピルト リメトキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリエト キシシラン、γートリフロロプロピルトリメトキシシラ ン、 y ートリフロロプロピルトリエトキシシランなど: 【0010】ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジェ トキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシラン、 ジメチルージーiso-プロポキシシラン、ジメチルー ジーnープトキシシラン、ジメチルージーsecープト キシシラン、ジメチルージーtert-ブトキシシラ ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージーn ープロポキシシラン、ジエチルージーisoープロポキ シシラン、ジエチルージーnープトキシシラン、ジエチ ルージーsecープトキシシラン、ジエチルージーte rtープトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、 ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロピル ジエトキシシラン、ジーnープロピルージーnープロポ キシシラン、ジーnープロピルージーisoープロポキ シシラン、ジーnープロピルージーnーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーsecーブトキシシラン、 ジーnープロピルージーtertーブトキシシラン、ジ -n-プロピルージーフェノキシシラン、ジーiso-プロピルジメトキシシラン、ジーiso-プロピルジエ トキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-プロポ キシシラン、ジーiso-プロピルージーiso-プロ ポキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-ブトキ シシラン、ジーisoープロピルージーsecーブトキ シシラン、ジーisoープロピルージーtertーブト キシシラン、ジーiso-プロピルージーフェノキシシ 50

ラン、ジーnーブチルジメトキシシラン、ジーnーブチ ルジエトキシシラン、ジーnープチルージーnープロポ キシシラン、ジーnーブチルージーisoープロポキシ シラン、ジーnープチルージーnープトキシシラン、ジ ーnーブチルージーsecーブトキシシラン、ジーnー ブチルージーtertープトキシシラン、ジーnープチ ルージーフェノキシシラン、ジーsecーブチルジメト キシシラン、ジーsec-ブチルジエトキシシラン、ジ - secーブチルージーnープロポキシシラン、ジーs 10 e c - ブチルージー i s o - プロポキシシラン、ジー s e c ープチルージーn ープトキシシラン、ジーsecー ブチルージーsecーブトキシシラン、ジーsecーブ チルージーtertーブトキシシラン、ジーsecーブ チルージーフェノキシシラン、ジーtertーブチルジ メトキシシラン、ジーtertーブチルジエトキシシラ ン、ジーtertーブチルージーnープロポキシシラ ン、ジーtertーブチルージーisoープロポキシシ ラン、ジーtertーブチルージーnーブトキシシラ ン、ジーtertーブチルージーsecープトキシシラ 20 ン、ジーtertーブチルージーtertーブトキシシ ラン、ジーtertープチルージーフェノキシシラン、 ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエトキ シシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラン、ジ フェニルージーisoープロポキシシラン、ジフェニル ージーnープトキシシラン、ジフェニルージーsecー ブトキシシラン、ジフェニルージー tertーブトキシ シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニルトリ メトキシシランなど;を挙げることができる。

【0011】化合物(1)として好ましい化合物は、メ
30 チルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、
メチルトリーnープロポキシシラン、メチルトリーis
oープロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エ
チルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、
ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、
フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ガフェニルジメトキシシラン、ガフェニルジエトキシシランなどである。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用して
40 もよい。

【0012】化合物(2);上記一般式(2)において、R²で表される1価の有機基としては、先の一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。一般式(2)で表される化合物の具体例としては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーロープロポキシシラン、テトラーロープトキション、テトラーロープトキション、テトラーロープトキション、テトラーロープトキション、テトラーロープトキション、テトラーロープトキション、テトラーロープトキション、テトラーロープトキション、テトラーロープトキション、テトラーロープトキション、テトラーローのエブトキション

トラーn-ブトキシラン、テトラーsec-ブトキシシラン、テトラーtert-ブトキシシラン、テトラフェノキシシランなどが挙げられる。

0 【0013】化合物(3);上記一般式(3)におい

て、R³~R⁶で表される1価の有機基としては、先の 一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。一 般式(3)のうち、R'が酸素原子の化合物としては、 ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキ サン、ヘキサフェノキシジシロキサン、1,1,1, 3, 3-ペンタメトキシー3-メチルジシロキサン、 1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシー3-メチルジシ ロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシー3 ーメチルジシロキサン、1,1,1,3,3-ペンタメ トキシー3-エチルジシロキサン、1,1,1,3,3 ーペンタエトキシー3-エチルジシロキサン、1,1, 1、3、3-ペンタフェノキシ-3-エチルジシロキサ ン、1, 1, 1, 3, 3ーペンタメトキシー3ーフェニ ルジシロキサン、1、1、1、3、3-ペンタエトキシ -3-フェニルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペ ンタフェノキシー3ーフェニルジシロキサン、1,1, 3, 3-テトラメトキシー1, 3-ジメチルジシロキサ ン、1, 1, 3, 3ーテトラエトキシー1, 3ージメチ ルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー ラメトキシー1, 3ージエチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジエチルジシロキサ ン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー1, 3-ジエ チルジシロキサン、1,1,3,3-テトラメトキシー 1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テ トラエトキシー1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1. 3. 3ーテトラフェノキシー1. 3ージフェニルジ シロキサン、1, 1, 3-トリメトキシ-1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1,1,3-トリエトキシー 1. 3. 3-トリメチルジシロキサン、1. 1. 3-ト リフェノキシー1、3、3-トリメチルジシロキサン、 1, 1, 3-トリメトキシー1, 3, 3-トリエチルジ シロキサン、、1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3, 3 ートリエチルジシロキサン、、1, 1, 3-トリフェノ キシー1, 3, 3ートリエチルジシロキサン、、1, 1, 3-トリメトキシー1, 3, 3-トリフェニルジシ ロキサン、1, 1, 3-トリエトキシー1, 3, 3-ト リフェニルジシロキサン、1,1,3-トリフェノキシ -1, 3, 3-トリフェニルジシロキサン、1, 3-ジ メトキシー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサ ルジシロキサン、1, 3-ジフェノキシ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジメトキシー 1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサン、1, 3-ジェトキシー1、1、3、3-テトラエチルジシロキサ . ン、1、3ージフェノキシー1、1、3、3ーテトラエ チルジシロキサン、1、3-ジメトキシー1、1、3、 3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジエトキシ -1, 1, 3, 3-FF

シロキサンなどを挙げることができる。

【0014】これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサ ン、ヘキサエトキシジシロキサン、1, 1, 3, 3ーテ トラメトキシー1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3ーテトラエトキシー1, 3ージメチルジシロ キサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシー1, 3-ジ フェニルジシロキサン、1、3-ジメトキシー1、1、 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジエトキ シー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン、1, 10 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシ ロキサン、1, 3-ジェトキシ-1, 1, 3, 3-テト ラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げ ることができる。

【0015】また、一般式(3)において、dが0の化 合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキ シジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1,1,1, 2, 2 - ペンタメトキシー2 - メチルジシラン、1,1, 1, 2, 2-ペンタエトキシー2-メチルジシラ ン、1,1,1,2,2-ペンタフェノキシー2-メチ 1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テト 20 ルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタメトキシー2 ーエチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーペンタエトキ シー2ーエチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタフェノキシー2-エチルジシラン、1,1,1,2,2 ーペンタメトキシー2ーフェニルジシラン、1,1, 1, 2, 2-ペンタエトキシー2-フェニルジシラン、 1, 1, 1, 2, 2ーペンタフェノキシー2ーフェニル ジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー 1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフ ェノキシー1, 2ージメチルジシラン、1, 1, 2, 2 ーテトラメトキシー1, 2ージエチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジエチルジシラ チルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエト キシー1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシー1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2-トリメトキシー1, 2, 2-トリメチルジシラ ン、1, 1, 2-トリエトキシー1, 2, 2-トリメチ 40 ルジシラン、1, 1, 2-トリフェノキシー1, 2, 2 ートリメチルジシラン、1,1,2ートリメトキシー 1, 2, 2-トリエチルジシラン、、1, 1, 2-トリ エトキシー1, 2, 2ートリエチルジシラン、、1, 1, 2-トリフェノキシー1, 2, 2-トリエチルジシ ラン、、1, 1, 2ートリメトキシー1, 2, 2ートリ フェニルジシラン、1,1,2-トリエトキシー1, 2, 2-トリフェニルジシラン、、1, 1, 2-トリフ ェノキシー1, 2, 2ートリフェニルジシラン、1, 2 ージメトキシー1, 1, 2, 2ーテトラメチルジシラ 3-ジフェノキシー1、1、3、3ーテトラフェニルジ 50 ン、1、2-ジエトキシー1、1、2、2ーテトラメチ

ルジシラン、1,2-ジフェノキシー1,1,2,2-テトラメチルジシラン、1,2-ジメトキシー1,1,2,2-デトラエチルジシラン、1,2-ジエトキシー1,1,2,2-デトラエチルジシラン、1,2-ジフェノキシー1,1,2,2-デトラフェニルジシラン、1,2-ジエトキシー1,1,2,2-デトラフェニルジシラン、1,2-ジフェノキシー1,1,2,2-デトラフェニルジシラン、1,2-ジフェノキシー1,1,2,2-デトラフェニルジシランなどを挙げることができる。

【0016】これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラン、1,1,2,2ーテトラメトキシー1,2ージメチルジシラン、1,1,2,2ーテトラエトキシー1,2ージメチルジシラン、1,1,2,2ーテトラメトキシー1,2ージフェニルジシラン、1,2ージメトキシー1,1,2,2ーテトラメチルジシラン、1,2ージエトキシー1,1,2,2ーテトラメチルジシラン、1,2ージメトキシー1,1,2,2ーテトラフェニルジシラン、1,2ージエトキシー1,1,2,2ーテトラフェニルジシランなどを、好20ましい例として挙げることができる。

【0017】さらに、一般式(3)において、R'が-(CH。)。一で表される基の化合物としては、ビス (トリメトキシシリル) メタン、ビス (トリエトキシシ リル) メタン、ビス (トリーnープロポキシシリル) メ タン、ビス (トリーi-プロポキシシリル) メタン、ビ ス (トリーnープトキシシリル) メタン、ビス (トリー sec-ブトキシシリル) メタン、ビス (トリーt-ブ トキシシリル) メタン、1,2-ビス(トリメトキシシ リル) エタン、1,2-ビス(トリエトキシシリル)エ タン、1, 2-ビス (トリーn-プロポキシシリル) エ タン、1, 2-ビス (トリーi-プロポキシシリル) エ タン、1, 2-ビス (トリーn-プトキシシリル) エタ ン、1, 2-ビス (トリーsec-ブトキシシリル) エ タン、1, 2-ビス (トリーt-プトキシシリル) エタ ン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメト キシシリル) メタン、1-(ジエトキシメチルシリル) -1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジーn-プロポキシメチルシリル) -1- (トリーn-プロポキ シシリル) メタン、1 - (ジ-i-プロポキシメチルシ 40 リル) -1- (トリーiープロポキシシリル) メタン、 1-(ジーn-ブトキシメチルシリル)-1-(トリー n-ブトキシシリル) メタン、1- (ジーsec-ブト キシメチルシリル) -1- (トリーsecーブトキシシ リル) メタン、1- (ジ-t-ブトキシメチルシリル) -1- (トリーt-プトキシシリル) メタン、1- (ジ メトキシメチルシリル) -2- (トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリ エトキシシリル) エタン、1-(ジ-n-プロポキシメ チルシリル) -2- (トリーn-プロポキシシリル) エ 50

10 タン、1-(ジーi-プロポキシメチルシリル)-2-(トリーiープロポキシシリル) エタン、1ー(ジーn ープトキシメチルシリル) -2- (トリーnープトキシ シリル) エタン、1-(ジーsec-ブトキシメチルシ リル) -2- (トリーsecーブトキシシリル) エタ ン、1- (ジ-t-ブトキシメチルシリル) -2- (ト リー t ープトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメ チルシリル) メタン、ビス (ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーn-プロポキシメチルシリル) メタ 10 ン、ビス (ジーi-プロポキシメチルシリル) メタン、 ビス (ジーnーブトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーsecープトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーtーブトキシメチルシリル) メタン、1,2ービ ス (ジメトキシメチルシリル) エタン、1, 2ービス (ジエトキシメチルシリル) エタン、1, 2ービス (ジ ーn-プロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジーi-プロポキシメチルシリル) エタン、1, 2-ビス (ジーn-ブトキシメチルシリル) エタン、1,2 ービス (ジーsecーブトキシメチルシリル) エタン、 1, 2-ビス (ジーt-ブトキシメチルシリル) エタ ン、1、2-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 2 ービス (トリーnープロポキシシリル) ベンゼン、1, 2-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1、2-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ビス (トリーsecーブトキシシリル) ベンゼ ン、1, 2ービス (トリ-t- ブトキシシリル) ベンゼ ン、1,3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1、3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,3 30 ービス (トリーnープロポキシシリル) ベンゼン、1, 3-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1, 3-ビス (トリーロープトキシシリル) ベンゼン、 1, 3-ビス (トリーsecープトキシシリル) ベンゼ ン、1, 3-ビス (トリーt-ブトキシシリル) ベンゼ ン、1、4-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 4 ービス (トリーnープロポキシシリル) ベンゼン、1, 4-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1, 4-ビス (トリーn-ブトキシシリル) ベンゼン、 1, 4ービス (トリーsecーブトキシシリル) ベンゼ ン、1, 4ービス (トリー t ープトキシシリル) ベンゼ・ ンなど挙げることができる。

【0018】これらのうち、ビス(トリメトキシシリル)メタン、ビス(トリエトキシシリル)メタン、1,2ービス(トリメトキシシリル)エタン、1,2ービス(トリエトキシシリル)エタン、1ー(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリエトキシシリル)-1-(トリエトキシシリル)-2-(シメトキシシリル)エタン、1ー(ジエトキシシリル)エタン、1ー(ジエトキシシリル)

ルシリル) -2- (トリエトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメチルシリル) メタン、I, 2-ビス (ジメトキシメチルシリル) エタン、1, 2-ビス (ジメトキシメチルシリル) エタン、1, 2-ビス (トリメトキシシリル) ベンゼン、1, 2-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 3-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 3-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼンなどを好ましい例として挙げることができる。本発明において、(A) 成分を構成する化合物 (1) 、(2) および (3) の1種もしくは2種以上を用いることができる。

【0019】なお、上記化合物(1)~(3)の群から 選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮 合させる際に、化合物(1)~(3)の群から選ばれた 少なくとも1種のシラン化合物1モル当たり20モルを 越え150モル以下の水を用いることが好ましく、20 モルを越え130モルの水を加えることが特に好まし い。添加する水の量が20モル以下であると塗膜の耐ク ラック性が劣る場合があり、150モルを越えると加水 分解および縮合反応中のポリマーの析出やゲル化が生じ る場合がある。

【0020】本発明の(A)加水分解縮合物を製造する に際しては、上記化合物(1)~(3)の群から選ばれ た少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させ る際に、特定塩基性化合物を用いることが特徴である。 特定塩基性化合物を用いることにより、低比誘電率、高 弾性率でありさらに基板との密着性に優れたシリカ系膜 を得ることができる。本発明で使用することのできる特 定塩基性化合物としては、例えば、水酸化テトラメチル アンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、水酸 化テトラプロピルアンモニウム、水酸化テトラブチルア ンモニウムなどの水酸化テトラアルキルアンモニウム、 ピペリジン、1-メチルピペリジン、2-メチルピペリ ジン、3-メチルピペリジン、4-メチルピペリジン、 ピペラジン、1-メチルピペラジン、2-メチルピペラ ジン、1、4-ジメチルピペラジン、ピロリジン、1-メチルピロリジン、ジアザビシクロオクタン、ジアザビ シクロノナン、ジアザビシクロウンデセン、2-ピラゾ リン、3-ピロリン、キヌキリジンなどの脂肪族環状有 機アミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化 リチウム、水酸化セシウムなどの金属水酸化物を挙げる ことができ、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化 テトラエチルアンモニウム、水酸化テトラプロピルアン モニウム、水酸化テトラブチルアンモニウム、ピペリジ ン、1-メチルピペリジン、ピペラジン、1-メチルピ ペラジン、1,4ージメチルピペラジン、ピロリジン、 1-メチルピロリジン、ジアザビシクロオクタン、ジア 50 しては、

ザビシクロノナン、ジアザビシクロウンデセン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウムがシリカ 系膜の基板への密着性の点から特に好ましい。これらの 特定塩基性化合物は、1種あるいは2種以上を同時に使 用してもよい。

12

【0021】上記特定塩基性化合物の使用量は、化合物 (1) ~ (3) 中の R^1 O - 基、 R^2 O - 基、 R^4 O - 基および R^6 O - 基で表される基の総量1モルに対し て、通常、0.0001~10モル、好ましくは0.0005~5モル、特に好ましくは0.001~1モル、さらに好ましくは0.01~0.5モルである。特定塩基性化合物の使用量が上記範囲内であれば、反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが少ない。

【0022】このようにして得られる(A)加水分解縮合物の慣性半径は、GPC(屈折率,粘度,光散乱測定)法による慣性半径で、好ましくは5~50nm、さらに好ましくは8~40nm、特に好ましくは9~20nmである。加水分解縮合物の慣性半径が5~50nmであると、得られるシリカ系膜の比誘電率、弾性率および膜の均一性に特に優れるものとできる。また、このようにして得られる(A)加水分解縮合物は、粒子状の形態をとっていないことにより、基板状への塗布性が優れるという特徴を有している。粒子状の形態をとっていないことは、例えば透過型電子顕微鏡観察(TEM)により確認される。

【0023】なお、(A)成分中、各成分を完全加水分 解縮合物に換算したときに、化合物(2)は、化合物 (1)~(3)の総量中、5~75重量%、好ましくは 10~70重量%、さらに好ましくは15~70重量% である。また、化合物(1)および/または(3)は、 化合物(1)~(3)の総量中、95~25重量%、好 ましくは90~30重量%、さらに好ましくは85~3 0 重量%である。化合物 (2) が、化合物 (1) ~ (3) の総量中、5~75重量%であることが、得られ る塗膜の弾性率が高く、かつ低誘電性に特に優れる。こ こで、本発明において、完全加水分解縮合物とは、化合 物(1)~(3)中のR'O-基, R'O-基, R'O -基およびR⁵ O-基が100%加水分解してSiOH 基となり、さらに完全に縮合してシロキサン構造となっ たものをいう。また、(A)成分としては、得られる組 成物の貯蔵安定性がより優れるので、化合物(1)およ び化合物(2)の加水分解縮合物であることが好まし

【0024】さらに、(A)加水分解縮合物では、化合物(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を、特定塩基性化合物の存在下に加水分解・縮合して、加水分解縮合物とし、好ましくはその慣性半径を5~50nmとなすが、その後、組成物のpHを7以下に調整することが好ましい。pHを調整する方法と

① p H調整剤を添加する方法、

2常圧または減圧下で、組成物中より特定塩基性化合物 を留去する方法、

③窒素、アルゴンなどのガスをバブリングすることによ り、組成物中から特定塩基性化合物を除去する方法、

④イオン交換樹脂により、組成物中から特定塩基性化合 物を除く方法、

⑤抽出や洗浄によって特定塩基性化合物を系外に除去す る方法、などが挙げられる。これらの方法は、それぞ れ、組み合わせて用いてもよい。

【0025】ここで、上記pH調整剤としては、無機酸 や有機酸が挙げられる。無機酸としては、例えば、塩 酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸、ホウ酸、シュウ酸な どを挙げることができる。また、有機酸としては、例え ば、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキ サン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン 酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン 酸、セバシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキ ドン酸、シキミ酸、2-エチルヘキサン酸、オレイン 酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチ ル酸、安息香酸、pーアミノ安息香酸、pートルエンス ルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジク ロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、 マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン 酸、酒石酸、コハク酸、フマル酸、イタコン酸、メサコ ン酸、シトラコン酸、リンゴ酸、グルタル酸の加水分解 物、無水マレイン酸の加水分解物、無水フタル酸の加水 分解物などを挙げることができる。これら化合物は、1 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0026】上記pH調整剤による組成物のpHは、7 以下、好ましくは1~6に調整される。このように、加 水分解縮合物の慣性半径を5~50nmとなしたのち、 上記pH調整剤により上記範囲内にpHを調整すること により、得られる組成物の貯蔵安定性が向上するという 効果が得られる。pH調整剤の使用量は、組成物のpH が上記範囲内となる量であり、その使用量は、適宜選択 される。

【0027】(B)有機溶媒

本発明の膜形成用組成物は、(A)成分を、通常、

(B) 有機溶媒に溶解または分散してなる。この(B) 有機溶媒としては、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、 アミド系溶媒、エステル系溶媒および非プロトン系溶媒 の群から選ばれた少なくとも1種が挙げられる。ここ で、アルコール系溶媒としては、メタノール、エタノー ル、nープロパノール、iープロパノール、nーブタノ ール、iープタノール、secーブタノール、tーブタ ノール、n ーペンタノール、i ーペンタノール、2 ーメ チルブタノール、secーペンタノール、tーペンタノ ール、3-メトキシブタノール、n-ヘキサノール、2 ーメチルペンタノール、sec-ヘキサノール、2-エ 50 2, 6, 6-テトラメチルー3, 5-ヘプタンジオン、

チルブタノール、sec-ヘプタノール、ヘプタノール -3、n-オクタノール、2-エチルヘキサノール、s e c - オクタノール、n - ノニルアルコール、2, 6-ジメチルヘプタノールー4、nーデカノール、sec-ウンデシルアルコール、トリメチルノニルアルコール、 secーテトラデシルアルコール、secーヘプタデシ ルアルコール、フェノール、シクロヘキサノール、メチ ルシクロヘキサノール、3,3,5-トリメチルシクロ ヘキサノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコ 10 ールなどのモノアルコール系溶媒;

【0028】エチレングリコール、1,2-プロピレン グリコール、1,3-プチレングリコール、ペンタンジ オールー2, 4、2-メチルペンタンジオールー2, 4、ヘキサンジオールー2、5、ヘプタンジオールー 2、4、2-エチルヘキサンジオール-1,3、ジエチ レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレ ングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価ア ルコール系溶媒:エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン 20 グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシル エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、 エチレングリコールモノー2-エチルブチルエーテル、 ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ 30 ールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、 ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多 価アルコール部分エーテル系溶媒;などを挙げることが できる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2 種以上を同時に使用してもよい。

【0029】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチル エチルケトン、メチルーnープロピルケトン、メチルー n-ブチルケトン、ジエチルケトン、メチルーi-ブチ 40 ルケトン、メチルーnーペンチルケトン、エチルーnー ブチルケトン、メチルーnーヘキシルケトン、ジーiー ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノ ン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4 ーペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノ ン、フェンチョンなどのほか、アセチルアセトン、2, 4-ヘキサンジオン、2, 4-ヘプタンジオン、3, 5 ーヘプタンジオン、2、4ーオクタンジオン、3、5ー オクタンジオン、2,4ーノナンジオン、3,5ーノナ ンジオン、5-メチル-2,4-ヘキサンジオン、2,

1, 1, 1, 5, 5, 5ーヘキサフルオロー2, 4ーヘ プタンジオンなどのβージケトン類などが挙げられる。 これらのケトン系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時 に使用してもよい。

【0030】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、N -メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミ ド、N-エチルホルムアミド、N, N-ジエチルホルム アミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-エチルアセトアミド、 N, N-ジエチルアセトアミド、N-メチルプロピオン アミド、N-メチルピロリドン、N-ホルミルモルホリ ン、Nーホルミルピペリジン、Nーホルミルピロリジ ン、Nーアセチルモルホリン、Nーアセチルピペリジ ン、Nーアセチルピロリジンなどが挙げられる。これら アミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用し てもよい。

【0031】エステル系溶媒としては、ジエチルカーボ ネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチ ル、酢酸メチル、酢酸エチル、ソーブチロラクトン、ソ ーバレロラクトン、酢酸nープロピル、酢酸iープロピ ル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、酢酸sec-ブ チル、酢酸nーペンチル、酢酸secーペンチル、酢酸 3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エ チルプチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、 酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸 n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢 酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレ ングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリ RO (CHCH, CH2O).R'

(R[®]およびR[®]は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 30 1~4のアルキル基またはCH, CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。)上記の 有機溶媒は、1種あるいは2種以上を混合して使用する ことができる。本発明においては、化合物(1)~ (3) を加水分解し、縮合する際に、上記と同様の溶媒 を使用することができる。

【0033】本発明の組成物の具体的な製造方法として は、化合物(1)~(3)を溶解させた溶媒中に水また は溶媒で希釈した水を断続的あるいは連続的に添加す る。この際、特定塩基性化合物は溶媒中に予め添加して 40 おいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分散さ せておいてもよい。この際の反応温度としては、通常、 $0 \sim 100$ $^{\circ}$ 、好ましくは $15 \sim 90$ $^{\circ}$ である。

【0034】その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド 状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活 性剤、シランカップリング剤、ラジカル発生剤、トリア ゼン化合物などの成分を添加してもよい。コロイド状シ リカとは、例えば、高純度の無水ケイ酸を前記親水性有 機溶媒に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~ 50 シド構造などが挙げられる。具体的には、ポリオキシメ

コールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノー n-ブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメ チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエ ーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ 10 チル、プロピオン酸 n - ブチル、プロピオン酸 i - アミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジーn-ブチル、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸nーブチル、乳酸nーアミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は、1 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。非プロト ン系溶媒としては、アセトニトリル、ジメチルスルホキ シド、N、N、N´、N´ーテトラエチルスルファミ ド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、Nーメチルモルホ ロン、Nーメチルピロール、N-エチルピロール、N-メチルーΔ3 ーピロリン、Nーメチルピペリジン、Nー エチルピペリジン、N, N-ジメチルピペラジン、N-メチルイミダゾール、N-メチル-4-ピペリドン、N -メチル-2-ピペリドン、N-メチル-2-ピロリド ン、1、3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、1、3 ージメチルテトラヒドロー2 (1H) ーピリミジノンな どを挙げることができる。

【0032】これらの有機溶剤の中で、特に下記一般式 (4) で表される有機溶剤が好ましい。

 $\cdots (4)$

30nm、好ましくは10~20nm、固形分濃度が1 0~40重量%程度のものである。このような、コロイ ド状シリカとしては、例えば、日産化学工業(株)製、 メタノールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾ ル;触媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられ る。コロイド状アルミナとしては、日産化学工業(株) 製のアルミナゾル520、同100、同200;川研フ ァインケミカル (株) 製のアルミナクリアーゾル、アル ミナゾル10、同132などが挙げられる。有機ポリマ ーとしては、例えば、糖鎖構造を有する化合物、ビニル アミド系重合体、 (メタ) アクリル系重合体、芳香族ビ ニル化合物、デンドリマー、ポリイミド、ポリアミック 酸、ポリアリーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、 ポリオキサジアゾール、フッ素系重合体、ポリアルキレ ンオキサイド構造を有する化合物などを挙げることがで きる。

【0035】ポリアルキレンオキサイド構造を有する化 合物としては、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチ レンオキサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、 ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキ

チレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキル エーテル、ポリオキシエテチレンアルキルフェニルエー テル、ポリオキシエチレンステロールエーテル、ポリオ キシエチレンラノリン誘導体、アルキルフェノールホル マリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレ ンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキ シエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルなど のエーテル型化合物、ポリオキシエチレングリセリン脂 肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エ ステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド硫酸 塩などのエーテルエステル型化合物、ポリエチレングリ コール脂肪酸エステル、エチレングリコール脂肪酸エス テル、脂肪酸モノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エ ステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコ ール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエー テルエステル型化合物などを挙げることができる。ポリ オキシチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー としては下記のようなブロック構造を有する化合物が挙 げられる。

$-(X) j - (Y) k - \cdots$

-(X) j - (Y) k - (X) l

(式中、Xは-CH₂CH₂O-で表される基を、Yは-CH₂CH (CH₃) O-で表される基を示し、jは1~ 90、kは10~99、1は0~90の数を示す) これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、 ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポ リマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアル キルエーテル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エ ステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、 などのエーテル型化合物をより好ましい例として挙げる ことができる。これらは1種あるいは2種以上を同時に 使用しても良い。

【0036】界面活性剤としては、例えば、ノニオン系 界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活 性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、フッ 素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、ポリアルキ レンオキシド系界面活性剤、ポリ(メタ)アクリレート 系界面活性剤などを挙げることができ、好ましくはフッ 素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤を挙げること ができる。

【0037】フッ素系界面活性剤としては、例えば1. 1, 2, 2ーテトラフロロオクチル (1, 1, 2, 2-テトラフロロプロピル) エーテル、1、1、2、2ーテ トラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチレン グリコールジ(1, 1, 2, 2-テトラフロロブチル) エーテル、ヘキサエチレングリコール(1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エーテル、オクタ・

ロブチル) エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ (1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エ ーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、 1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10-デカフ ロロドデカン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロ デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンア ミド) プロピル]-N, N '-ジメチル-N-カルボキ シメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキ ルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、 10 パーフルオロアルキル-N-エチルスルホニルグリシン 塩、リン酸ビス(N-パーフルオロオクチルスルホニル -N-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキ ルエチルリン酸エステル等の末端、主鎖および側鎖の少 なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオ ロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面活 性剤を挙げることができる。また、市販品としてはメガ ファックF142D、同F172、同F173、同F1 83 (以上、大日本インキ化学工業(株)製)、エフト ップEF301、同303、同352 (新秋田化成 (株) 製)、フロラードFC-430、同FC-431 (住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG71 0、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-1 05、同SC-106(旭硝子(株)製)、BM-10 00、BM-1100(裕商(株)製)、NBX-15 ((株)ネオス)などの名称で市販されているフッ素系 界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上 記メガファックF172, BM-1000, BM-11 00, NBX-15が特に好ましい。シリコーン系界面 30 活性剤としては、例えばSH7PA、SH21PA、S H30PA、ST94PA (いずれも東レ・ダウコーニ ング・シリコーン(株)製などを用いることが出来る。 これらの中でも、上記SH28PA、SH30PAが特 ·に好ましい。界面活性剤の使用量は、(A)成分(完全 加水分解縮合物)に対して通常の、0001~10重量 部である。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用 しても良い。

【0038】シランカップリング剤としては、例えば3 ーグリシジロキシプロピルトリメトキシシラン、3ーア 40 ミノグリシジロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3ーグリ シジロキシプロピルメチルジメトキシシラン、1ーメタ クリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミ ノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルト リエトキシシラン、2-アミノプロピルトリメトキシシ ラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロピルトリメトキ シシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロ ピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロピルト プロピレングリコールジ(1, 1, 2, 2ーテトラフロ 50 リメトキシシラン、3ーウレイドプロピルトリエトキシ

シラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピル トリメトキシシラン、N-エトキシカルボニルー3-ア ミノプロピルトリエトキシシラン、N-トリエトキシシ リルプロピルトリエチレントリアミン、Nートリエトキ シシリルプロピルトリエチレントリアミン、10ートリ メトキシシリルー1, 4, 7ートリアザデカン、10ー トリエトキシシリルー1, 4, 7ートリアザデカン、9 -トリメトキシシリル-3,6-ジアザノニルアセテー ト、9-トリエトキシシリル-3,6-ジアザノニルア セテート、N-ベンジルー3-アミノプロピルトリメト キシシラン、N-ベンジル-3-アミノプロピルトリエ トキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリ メトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルト リエトキシシラン、N-ビス (オキシエチレン) -3-アミノプロピルトリメトキンシラン、N-ビス(オキシ エチレン) -3-アミノプロピルトリエトキシシランな どが挙げられる。これらは1種あるいは2種以上を同時 に使用しても良い。

【0039】ラジカル発生剤としては、例えばイソブチ ーオキシ) ジイソプロピルベンゼン、クミルパーオキシ ネオデカノエート、ジーnプロピルパーオキシジカーボ ネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、 1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキシネオデ カノエート、ビス (4 – t –ブチルシクロヘキシル) パ ーオキシジカーボネート、1 - シクロヘキシルー1 - メ チルエチルパーオキシネオデカノエート、ジー2-エト キシエチルパーオキシジカーボネート、ジ(2-エチル ヘキシルパーオキシ) ジカーボネート、t-ヘキシルパ ーオキシネオデカノエート、ジメトキブチルパーオキシ ジカーボネート、ジ (3-メチル-3-メトキシブチル パーオキシ) ジカーボネート、t ーブチルパーオキシネ オデカノエート、2、4-ジクロロベンゾイルパーオキ サイド、t-ヘキシルパーオキシピバレート、t-ブチ ルパーオキシピバレート、3,5,5-トリメチルヘキ サノイルパーオキサイド、オクタノイルパーオキサイ ド、ラウロイルパーオキサイド、ステアロイルパーオキ サイド、1, 1, 3, 3-テトラメチルプチルパーオキ シ2-エチルヘキサノエート、スクシニックパーオキサ イド、2、5-ジメチルー2、5-ジ(2-エチルヘキ サノイルパーオキシ) ヘキサン、1-シクロヘキシルー 1-メチルエチルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t-ヘキシルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t-ブチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、 m-トルオイルアンドベンゾイルパーオキサイド、ベン ゾイルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシイソブチ レート、ジーtーブチルパーオキシー2ーメチルシクロ ヘキサン、1,1-ビス (t-ヘキシルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1ービス (t-ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1,1-

ビス (tーブチルパーオキシ) -3,3,5-トリメチ ルシクロヘキサン、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキ シ) シクロヘキサン、2, 2-ビス(4, 4-ジーtー ブチルパーオキシシクロヘキシル)プロパン、1,1-ビス (tーブチルパーオキシ) シクロデカン、tーヘキ シルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、 t ーブ チルパーオキシマレイン酸、t-ブチルパーオキシー 3、3、5-トリメチルヘキサノエート、t-ブチルパ ーオキシラウレート、2,5-ジメチルー2,5-ジ (m-トルオイルパーオキシ) ヘキサン、t-ブチルパ ーオキシイソプロピルモノカーボネート、tーブチルパ ーオキシ2ーエチルヘキシルモノカーボネート、 t ーヘ キシルパーオキシベンゾエート、2,5-ジメチルー 2, 5-ジ (ベンソイルパーオキシ) ヘキサン、t-ブ チルパーオキシアセテート、2, 2-ビス(t-ブチル パーオキシ) ブタン、tーブチルパーオキシベンゾエー ト、n - ブチルー 4 , 4 - ビス (t - ブチルパーオキ シ) バレレート、ジーtーブチルパーオキシイソフタレ ート、α、α'ビス(tープチルパーオキシ)ジイソプ リルパーオキサイド、 α 、 α ' ビス(ネオデカノイルパ 20 ロピルベンゼン、ジクミルパーオキサイド、2, 5 - \circ メチルー2, 5-ジ(t-ブチルパーオキシ)へキサ ン、tーブチルクミルパーオキサイド、ジーtーブチル パーオキサイド、pーメンタンヒドロパーオキサイド、 2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(t-ブチルパーオキ シ) ヘキシン-3、ジイソプロピルベンゼンヒドロパー オキサイド、t-ブチルトリメチルシリルパーオキサイ ド、1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチルヒドロパーオ キサイド、クメンヒドロパーオキサイド、t-ヘキシル ヒドロパーオキサイド、tーブチルヒドロパーオキサイ ド、2、3-ジメチル-2、3-ジフェニルブタン等を 挙げることができる。ラジカル発生剤の配合量は、重合 体100重量部に対し、0.1~10重量部が好まし い。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても 良い。

【0040】トリアゼン化合物としては、例えば、1, 2-ビス (3, 3-ジメチルトリアゼニル) ベンゼン、 1, 3-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼ ン、1, 4ービス (3, 3ージメチルトリアゼニル) ベ ンゼン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフェニ 40 ル) エーテル、ビス (3, 3 – ジメチルトリアゼニルフ ェニル) メタン、ビス (3, 3-ジメチルトリアゼニル フェニル)スルホン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼ ニルフェニル) スルフィド、2, 2-ビス〔4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフェノキシ)フェニル]ー 1, 1, 1, 3, 3, 3ーヘキサフルオロプロパン、 2, 2-ビス〔4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフ ェノキシ)フェニル]プロパン、1,3,5ートリス (3, 3-ジメチルトリアゼニル) ベンゼン、2, 7-ビス (3, 3-ジメチルトリアゼニル) -9, 9-ビス [4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル]フ

(12)

ルオレン、2, 7ービス(3, 3-ジメチルトリアゼニ ル) -9, 9-ビス[3-メチル-4-(3, 3-ジメ チルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2,7ービ ス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス [3-フェニルー4ー(3, 3-ジメチルトリアゼニ ル) フェニル] フルオレン、2, 7ービス(3, 3-ジ メチルトリアゼニル) -9, 9-ビス[3-プロペニル -4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル]ブ ルオレン、2、7ービス(3、3-ジメチルトリアゼニ (μ) - 9, 9 - ビス [3 - フルオロー4 - (3, 3 - ジ 10) メチルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2、7-ビス (3, 3-ジメチルトリアゼニル) -9, 9-ビス [3, 5-ジフルオロー4-(3, 3-ジメチルトリア ゼニル) フェニル] フルオレン、2, 7ービス (3, 3 ージメチルトリアゼニル) -9, 9-ビス「3-トリフ ルオロメチルー4ー(3,3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フルオレンなどが挙げられる。これらは1種 あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0041】膜形成用組成物の調製方法

本発明の膜形成用組成物を調製するに際しては、例えば、溶媒中化合物(1)~(3)を混合して、水を連続的または断続的に添加して、加水分解し、縮合し、

(A) 成分を調製したのち、これに(B) 成分を添加すればよく、特に限定されない。

【0042】本発明の組成物の調製方法の具体例としては、下記1)~11)の方法などを挙げることができる。

- 1) (A) 成分を構成する化合物(1)~(3)、特定 塩基性化合物および有機溶媒からなる混合物に、所定量 の水を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
- 2) (A) 成分を構成する化合物(1)~(3)、特定 塩基性化合物および有機溶媒からなる混合物に、所定量 の水を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮 合反応を行う方法。
- 3) (A) 成分を構成する化合物(1)~(3) および 有機溶媒からなる混合物に、所定量の水および特定塩基 性化合物を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
- 4) (A) 成分を構成する化合物(1)~(3) および 有機溶剤からなる混合物に、所定量の水および特定塩基 性化合物を連続的あるいは断続的に添加して、加水分 解、縮合反応を行う方法。
- 5) 有機溶剤、水および特定塩基性化合物からなる混合物に、所定量の(A)成分を構成する化合物(1)~
- (3)を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
- 6) 有機溶剤、水および特定塩基性化合物からなる混合物に、所定量の(A) 成分を構成する化合物(1) ~
- (3) を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・ 縮合反応を行う方法。
- 7) 有機溶剤、水および特定塩基性化合物からなる混合物に、所定量の(A) 成分を構成する化合物(1)~

- (3) を加えて、加水分解・縮合反応を行い、p H調整 剤を添加する方法。
- 8) 有機溶剤、水および特定塩基性化合物からなる混合物に、所定量の(A) 成分を構成する化合物(1)~
- (3) を加えて、加水分解・縮合反応を行い、溶液の一 定濃度に濃縮した後 p H調整剤を添加する方法。
- 9)上記1)~8)の方法で得られた溶液を、別な有機溶剤で抽出する方法。
- 10)上記1)~8)の方法で得られた溶液を、別な有機溶剤で置換する方法。
- 11)上記1)~8)の方法で得られた溶液を、別な有機溶剤で抽出した後、更に別な有機溶剤で置換する方法。

【0043】このようにして得られる本発明の組成物の 全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、 使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃 度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲 となり、保存安定性もより優れるものである。なお、こ の全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上 記(D) 有機溶剤による希釈によって行われる。本発明 の組成物を、シリコンウエハ、SiO.ウエハ、SiN ウエハなどの基材に塗布する際には、スピンコート、浸 漬法、ロールコート法、スプレー法などの塗装手段が用 いられる。この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗り で厚さ0.05~2.5 m m 程度、2回塗りでは厚さ 0. 1~5. 0 μ m程度の塗膜を形成することができ る。その後、常温で乾燥するか、あるいは80~600 ℃程度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥 することにより、ガラス質または巨大髙分子の絶縁膜を 30 形成することができる。この際の加熱方法としては、ホ ットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用するこ とが出来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、 アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした 減圧下などで行うことができる。また、電子線や紫外線 を照射することによっても塗膜を形成させることができ る。また、上記途膜の硬化速度を制御するため、必要に 応じて、段階的に加熱したり、窒素、空気、酸素、減圧 などの雰囲気を選択することができる。このようにして 得られる本発明のシリカ系膜は、膜密度が、通常、0. 40 35~1.2g/cm³、好ましくは0.4~1.1g /cm³、さらに好ましくはO.5~1.0g/cm³ である。膜密度が0.35g/cm3 未満では、塗膜の 機械的強度が低下し、一方、1.2g/cm を超える と低比誘電率が得られない。また、本発明のシリカ系膜 は、BJH法による細孔分布測定において、10nm以 上の空孔が認められず、微細配線間の層間絶縁膜材料と して好ましい。さらに、本発明のシリカ系膜は、吸水性 が低い点に特徴を有し、例えば、塗膜を127℃、2. 5 a t m、100%RHの環境に1時間放置した場合、 50 放置後の塗膜のIRスペクトル観察からは塗膜への水の

吸着は認められない。この吸水性は、本発明における膜 形成用組成物に用いられる化合物 (1) のテトラアルコ キシシラン類の量により、調整することができる。さら に、本発明のシリカ系膜の比誘電率は、通常、2.6~ 1. 2、好ましくは2. 5~1. 2、さらに好ましくは 2. 4~1. 2である。

【0044】このようにして得られる層間絶縁膜は、P CT後の比誘電率特性、PCT後のCMP耐性、PCT 後の基板との密着性を示すことから、LSI、システム LSI、DRAM、SDRAM、RDRAM、D-RD 10 度100%RH、2気圧の条件でPCTを1時間行っ RAMなどの半導体素子用層間絶縁膜やエッチングスト ッパー膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多 層レジストを用いた半導体作製工程の中間層、多層配線 基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁膜な どの用途に有用である。

[0045]

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的 に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を 概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載に より本発明は限定されるものではない。なお、実施例お 20 よび比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞ れ重量部および重量%であることを示している。また、 各種の評価は、次のようにして行なった。

【0046】慣性半径

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ 一(GPC)(屈折率,粘度,光散乱測定)法により測 定した。

試料溶液:シラン化合物の加水分解縮合物を、固形分濃 度が0.25%となるように、10mMのLiBrを含 むメタノールで希釈し、GPC(屈折率、粘度、光散乱 30 ×:シリコンウエハと塗膜の界面での剥離発生 測定) 用試料溶液とした。

装置: 東ソー (株) 製、GPCシステム モデル GP C-8020

東ソー (株) 製、カラム Alpha5000/300

ビスコテック社製、粘度検出器および光散乱検出器 モデル T-60 デュアルメーター

キャリア溶液:10mMのLiBrを含むメタノール キャリア送液速度:1ml/min

カラム温度:40℃

【0047】PCT後の比誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で90℃で3分 間、窒素雰囲気200℃で3分間基板を乾燥し、さらに 450℃の真空(50mTorr) ホットプレートで3 0分基板を焼成した。得られた膜に対して100℃、湿 度100%RH、2気圧の条件でPCTを1時間行い、 蒸着法によりアルミニウム電極パターンを形成させ比誘 電率測定用サンプルを作成した。該サンプルを周波数1 00kHzの周波数で、横河・ヒューレットパッカード 50 mであった。

(株) 製、HP16451B電極およびHP4284A プレシジョンLCRメータを用いてCV法により当該途 膜の比誘電率を測定した。

24

【0048】PCT後のCMP耐性

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で90℃で3分 間、窒素雰囲気200℃で3分間基板を乾燥し、さらに 450℃の真空 (50mTorr) ホットプレートで3 0分基板を焼成した。得られた膜に対して100℃、湿 た。得られた塗膜を以下の条件で研磨した。

スラリー:シリカー過酸化水素系

研磨圧力:160g/cm²

研磨時間:180秒

CMP後の塗膜の外観を35万ルクスの表面観察用ラン プで観察し、下記基準で評価した。

【0049】<u>塗膜の密着性</u>

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で90℃で3分 間、窒素雰囲気200℃で3分間基板を乾燥し、さらに 450℃の真空(50mTorr) ホットプレートで3 0分基板を焼成した。得られた膜に対して100℃、湿 度100%RH、2気圧の条件でPCTを1時間行っ た。得られた基板上にエポキシ樹脂を用いてスタッドピ ン10本を固定し、150℃で1時間乾燥させた。この スタッドピンをセバスチャン法を用いて引き抜き試験行 い、以下の基準で密着性を評価した。

〇:スタッドピン10本共シリコンウエハと塗膜の界面 での剥離無し

【0050】合成例1

石英製セパラブルフラスコに、蒸留エタノール570 g、イオン交換水160gと10%水酸化テトラメチル アンモニウム水溶液30gを入れ、均一に攪拌した。こ の溶液にメチルトリメトキシシラン136gとテトラエ トキシシラン209gの混合物を添加した。溶液を55 ℃に保ったまま、2時間反応を行った。この溶液にプロ ピレングリコールモノプロピルエーテル300gを加 え、その後、50℃のエバポレーターを用いて溶液を1 40 0% (完全加水分解縮合物換算)となるまで濃縮し、そ の後、酢酸の10%プロピレングリコールモノプロピル エーテル溶液10gを添加し、反応液Φを得た。このよ うにして得られた縮合物等の慣性半径は、13.4nm であった。

【0051】合成例2

合成例1において、10%水酸化テトラメチルアンモニ ウム水溶液の代わりに10%ピペラジン水溶液を使用し た以外は合成例1と同様にして、反応液②を得た。この ようにして得られた縮合物等の慣性半径は、13.0 n

【0052】合成例3

合成例1において、10%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液の代わりに10%ジアザビシクロウンデセン水溶液を使用した以外は合成例1と同様にして、反応液 ②を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、15.0nmであった。

【0053】合成例4

合成例1において、10%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液の代わりに10%水酸化ナトリウム水溶液を使用した以外は合成例1と同様にして、反応液②を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、14.8nmであった。

【0054】合成例5

石英製セパラブルフラスコに、蒸留エタノール470.9g、イオン交換水226.5gと25%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液17.2gを入れ、均一に攪拌した。この溶液にメチルトリメトキシシラン44.9gとテトラエトキシシラン68.6gの混合物を添加した。溶液を55℃に保ったまま、2時間反応を行った。この溶液に20%硝酸水溶液50gを添加し、十分攪拌20した後、室温まで冷却した。この溶液にプロピレングリコールモノプロピルエーテル400gを加え、その後、50℃のエバポレーターを用いて溶液を10%(完全加水分解縮合物換算)となるまで濃縮し、その後、マレイン酸の10%プロピレングリコールモノプロピルエーテル溶液10gを添加し、反応液⑤を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、20.9nmであった。

【0055】合成例6

合成例5において、25%水酸化テトラメチルアンモニ 30 ウム水溶液の代わりに25%水酸化テトラブチルアンモニウム水溶液を使用したこと以外は合成例5と同様にして、反応液**⑤**を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、22.8nmであった。

【0056】合成例7

合成例5において、プロピレングリコールモノプロピルエーテルの代わりにプロピレングリコールモノエチルエーテルを使用したこと以外は合成例5と同様にして、反応液⑦を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、20.8nmであった。

【0057】比較合成例1

合成例1において、10%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液の代わりに10%ピリジン水溶液を使用した 以外は合成例1と同様にして、反応液②を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、3.8 nmであった。

【0058】比較合成例2

石英製セパラブルフラスコに、メチルトリメトキシシラン154.24g、テトラメトキシシラン288.83gと蒸留プロピレングリコールモノエチルエーテル250gを溶解し、マレイン酸10gを溶解したイオン交換水297gを1時間かけて溶液に滴下した。この溶液を50℃で3時間反応させることで反応液②を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、0.2nmであった。

【0059】実施例1

合成例1で得られた反応液 ① を0.2μm 孔径のテフロン (登録商標) 製フィルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。得られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗布した。塗膜の P C T 後の迷膜を CMP しても塗膜に傷は認められなかった。また、 P C T 後の塗膜の密着性も良好であった。

【0060】実施例2~7

表1に示す組成で膜形成用組成物を作製し、実施例1と 同様に評価を行った。評価結果を表1に併せて示す。

[0061]

【表1】

実施例	反応被	PCT後の 比誘電率	PCT後の CMP耐性	PCT後の 密着性
1	反応液①	2.27	0	0
2	反応被②	2.29	0	0
3	反応被③	2.14	0	0
4	反応被④	2.16	. 0	0
5	反応被⑤	2.15	0	0
6	反応被⑥	2.14	0	0
7	反応被⑦	2.16	. 0	0

【0062】比較例1

比較合成例1で得られた反応液®を使用した以外は実施 た。また、PCT後の塗肥例1と同様にして塗膜の評価を行った。塗膜のPCT後 ろ、スタッドプルピンの5の比誘電率は2.67と比較的低い値であったが、PC 50 界面での剥離が発生した。

T後の塗膜をCMP処理行った際に表面に傷が認められた。また、PCT後の塗膜の密着性評価を行ったところ、スタッドプルピンの5本でシリコンウエハと塗膜の

【0063】比較例2

比較合成例2で得られた反応液 ②を使用した以外は実施例1と同様にして塗膜の評価を行った。 PCT後の塗膜の比誘電率は3.88と高い値であった。また、PCT後の塗膜の密着性評価を行ったところ、スタッドプルピンの3本でシリコンウエハと塗膜の界面での剥離が発生した。

[0064]

【発明の効果】本発明によれば、特定の塩基性化合物と 水の存在下アルコキシシラン加水分解および/または縮 合を行うことで、PCT後の比誘電率特性、PCT後の CMP耐性、PCT後の基板との密着性に優れた膜形成 用組成物(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能で ある。

フロントページの続き

F 夕一ム(参考) 4J038 DL021 DL031 DL041 DL071
DL161 GA01 GA07 GA09
GA12 HA096 HA176 HA216
HA326 HA376 HA416 HA476
JA18 JA20 JA21 JA22 JA26
JA33 JA34 JA37 JA38 JA41
JA42 JA56 JB01 JB11 JB13
JB18 JB27 JB29 JB30 JB38
JB39 JC13 KA04 KA16 LA03
MA08 MA10 NA11 NA12 NA21
PA19 PB09 PC01 PC02
5F058 AA08 AA10 AC03 AC06 AF04

AG01 AH02

```
WPI Acc No: 2002-091573/200213
                                                                   014270872
                                 (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
                                               DIALOG(R) File 352: Derwent WPI
                                                                       E/9/I <del>(~</del>
                                                      File Segment: CPI; EPI
                                                              HOIL-021/316
         International Patent Class (Additional): CO9D-005/25; CO9D-183/06;
                            International Patent Class (Main): HOLL-021/312
                                     Derwent Class: A82; A85; GO2; LO3; Ull
                                                   SECTETC: FILM; DENSITY
     Title Terms: FILM; INTERLAYER; INSULATE; FILM; SEMICONDUCTOR; ELEMENT;
                                                   pp; 20 DwgNo 0/0
                                                    mechanical strength.
         ADVANTAGE - The film has superior dielectric constant and
                                     for use in a semiconductor element.
  USE - The method forms the film for an interlayer insulating film
                                                        0.7 - 8.0 = x
                                                       0.8 - 5.0 = v
                                                        .6.1 - 8.1 = x
           DETAILED DESCRIPTION - The film consists of formula (1).
                                 kekka. TXT
            NOVELTY - A film has a film density of 0.5 - 1.4 g/cm3.
                                          Abstract (Basic): JP 2001203197 A
                                        20 HOIL-021/312
                                                            A 7618031002 91
                         Filing Notes
                                          Main IPC
                                                    Patent No Kind Lan Pg
                                                            Patent Details:
             Priority Applications (No Type Date): JP 200012513 A 20000121
        20000121 200218
                           A
                                 JP 200012513
                                               2001002
                                                              JP 2001203197
          Meek
                   Date
                          Kind
                                  Applicat No
                                                 Date
                                                        Kind
                                                                  Patent No
                                                             Patent Family:
                          Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
                                           Patent Assignee: JSR CORP (JAPS
                                                   specific film density
Film for interlayer insulating film, used in semiconductor elements, has
                                                   XKPX Acc No: NO2-101222
                                                   XKAM Acc No: CO2-041195
                                            WPI Acc No: 2002-133815/200218
                                          ** Sinage available**
                                                                  014313113
                               (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
                                             DIALOG(R)File 352:Derwent WPI
                                                                     Z/S/I ←
                                                    File Segment: CPI; EPI
        International Patent Class (Additional): C09D-183/02; C09D-183/14
                            International Patent Class (Main): C09D-183/04
                               Detwent Class: A26; A85; E11; GO2; LO3; U11
                : COMPOUND: HYDROLYSIS: PRESENCE; NITROGEN; ONIUM; SALT
```

INTERLAYER; INSULATE; MEMBRANE; SEMICONDUCTOR; ELEMENT; ONE; KIND; SILANE

TITLE TELES: WENDERCINKE: WELHOD: WEWERENE: FORWING: COMPOSITION:

and condensing at least one silane compound and an organic solvent

XKAM Acc No: CO2-028431

Related WPI Acc No: 2002-149260

Composition for film formation, comprises product obtained by hydrolyzing